

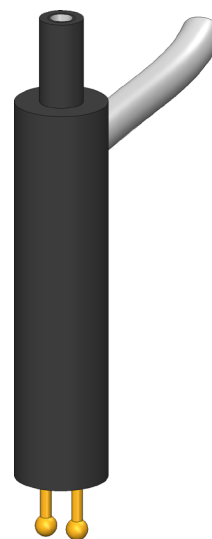


直接訪問產品

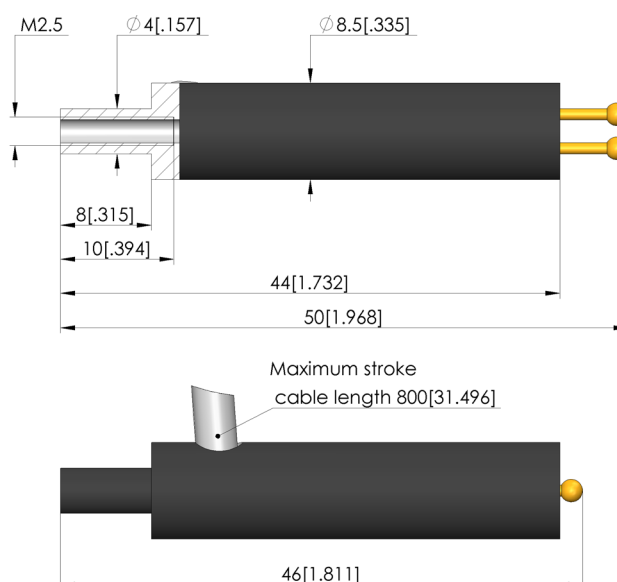
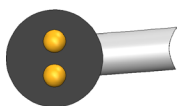
- 开路测试用组件, 用于半导体芯片的电容式测试, 检测其是否断裂、短路和存在焊接缺陷
- 适用于 SPEA 测试系统

### 使用

OpenPin Check 探针用于集成电路的电容测试, 可检查集成电路内部的接线接口是否存在断裂、短路和缺陷焊接。



1:1



### 一般数据

产品组:  
结构系列:  
类型:  
规格:  
配件类型:  
交付状态:  
高度:  
重量:  
最小温度:  
最大温度:  
RoHS 符合性:

开路测试  
OTC  
SPEA opens test  
OpenPin Check  
扩展配件  
Escan-Probe-50  
50 mm  
0,01 kg  
10 °C  
60 °C  
是

### 适用于

替换套件 (WS):

### 技术数据

行程:  
安装:  
极数:  
直径:  
轴径直径:  
电缆长度:

WS SPEA

4 mm  
螺纹 M2.5  
2  
8,5 mm  
4 mm  
800 mm

# Escan ElectroScanProbe-50 OTC-SP-ES-EP-L800

产品 33515



**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



## **INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真: +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。04/26\_CN